



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ

Номер регистрации (свидетельства):
2023683837

Дата регистрации: 10.11.2023

Номер и дата поступления заявки:
2023682149 26.10.2023

Дата публикации и номер бюллетеня:
10.11.2023 Бюл. № 11

Контактные реквизиты:
нет

Автор(ы):

Турыгин Антон Павлович (RU)

Правообладатель(и):

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Уральский федеральный
университет имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина» (RU)

Название программы для ЭВМ:

Программа для фрактального и мультифрактального анализа АСМ изображений поверхности тонких пленок

Реферат:

Программа предназначена для определения характеристик поверхности тонких пленок методами фрактального анализа. Входные данные: двумерный массив высот поверхности (рельеф) тонкой пленки, измеренный методом атомно-силовой микроскопии. Для анализа массива данных используются: автокорреляционная функция, функция корреляции высота-высота и двумерный мультифрактальный анализ флуктуаций поверхности. Результаты расчета представляют собой: величину арифметической шероховатости, длину корреляции, фрактальную размерность и, параметры мультифрактального спектра. Программа может быть использована для определения количественных характеристик рельефа поверхности различных тонких пленок. Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках Программы развития УрФУ в соответствии с программой стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Язык программирования: Wolfram

Объем программы для ЭВМ: 47 КБ